

Fiche d'application n° 10

Recherche des contaminants de surface

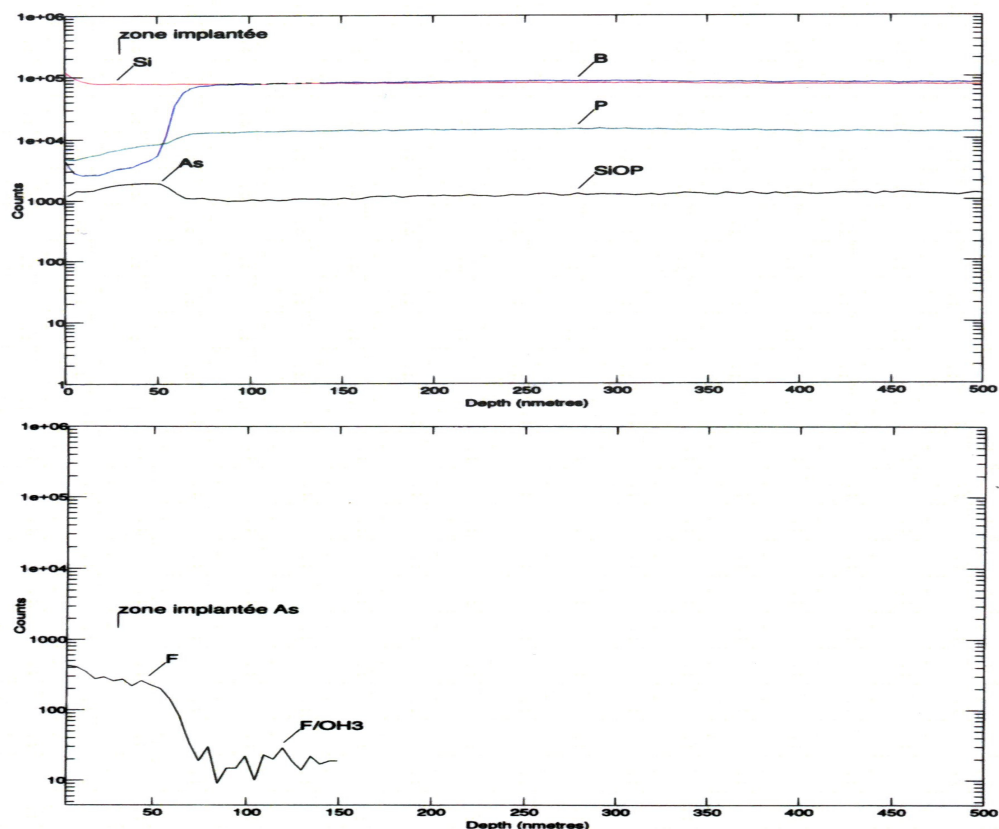
V2

Objet : Recherche de contaminants en surface d'une couche de SiO₂ dopée B et P, implantée As en surface

Technique mise en œuvre : **SIMS**

- ✓ Profils de répartition en profondeur avec un excellente résolution en profondeur
- ✓ Très grande sensibilité

Résultats :



Conclusion :

Présence de traces de fluor (< qq ppm) dans la zone implantée As